

# '97 Digital OBIC Scanner セミナー

会期：平成9年11月14日(金)

## プログラム

- |               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| 12:00 ~ 13:00 | 受付 (鳳凰の間)                                       |                |
| 13:00 ~ 13:05 | ご挨拶   | 日本電子(株)        |
| 13:05 ~ 13:35 | 「OBICによるLSIの故障解析について」<br>(株)アイテス                | 三浦 伸仁 氏        |
| 13:35 ~ 14:05 | 「OBIRCH法の現状」                                    | 日本電気(株) 二川 清 氏 |
| 14:05 ~ 14:35 | 「OBIRCHによるAl-Cu配線のエレクトロマイグレーション評価」<br>松下電子工業(株) | 小川 真一 氏        |
| 14:35 ~ 14:55 | <コーヒー・ブレイク>                                     |                |
| 14:55 ~ 15:25 | 「裏面OBIC法による半導体デバイスの故障解析事例」<br>富士通VLSI(株)        | 伊藤 誠吾 氏        |
| 15:25 ~ 15:55 | 「OBIC装置の今後」<br>日本電子ライオソニック(株)                   | 上田 勝英          |
| 15:55 ~ 16:25 | 「FIB/SEMによる半導体デバイスの欠陥解析と構造評価」<br>日本電子(株)        | 坂田 隆英          |
| 16:25 ~ 16:30 | ご挨拶   | 日本電子(株)        |
| 16:30 ~ 18:00 | 懇親会 (千歳の間)                                      |                |